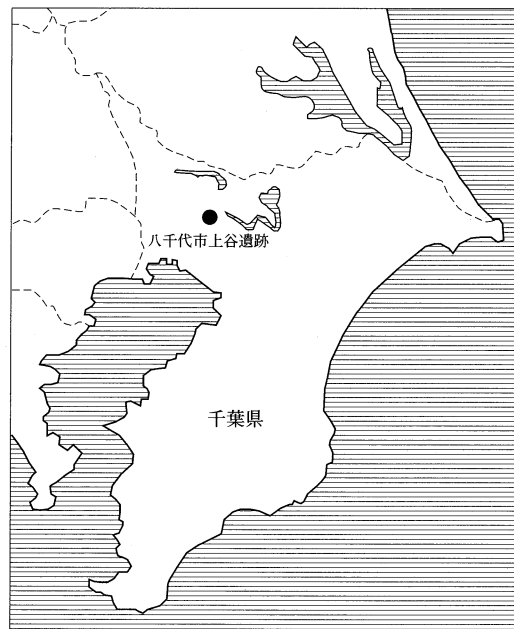


千葉県八千代市

上谷遺跡

(仮称) 八千代カルチャータウン開発事業関連埋蔵文化財調査報告書Ⅱ

— 第3分冊 —



2004

大成建設株式会社

八千代市遺跡調査会

凡 例

1. 遺構番号は発掘調査時には、遺構種別ではなく調査地区ごとの通番号を付与した。遺物の注記、図面・写真への記録はこれによった。しかし、本書では遺構別に通番号を新たに付与し直したこの遺構番号については、第1章に新旧番号の対照表を掲載したので参照していただきたい。

2. 本書の挿図において使用した地図は以下の通りである。いずれも一部改変・合成して使用している。

図1 国土地理院発行 1/25,000地形図 「小林」「佐倉」「白井」「習志野」(平成12年発行)

図2 大成建設株式会社発行 1/40,000 Y. K, プロジェクト 空中写真測量図(昭和63年発行)

3. 本書の挿図において、方位の表示のないものについては、公共座標に基づく座標北を上としている。

4. 本書の遺構実測図における用例は以下のとおりである。

(1) 図中及び本文中における方位は、公共座標に基づく座標北を示している。

(2) 縮尺率は原則として以下のとおりとするが、これ以外のものについては、図中に示したスケールを参照されたい。

住居跡 1/80 掘立柱建物 1/80 方形周溝墓 1/100 土坑 1/50 溝 1/50 炉穴 1/50

(3) 住居跡平面図に使用した一点鎖線は、床の硬化範囲を示している。

(4) 遺構実測図で使用した波線は、推定復元線を示している。

(5) 遺構実測中のスクリーントーンの表示は原則として以下のとおりであるが、個々については実測図協に表示した凡例を参照されたい。



(6) 竈のある住居跡にあつては、長軸と短軸の距離及び方位は、各コーナーから対角線に線を引いた上で住居の中心を出し、その中心の壁間での計測値を出した。また、主軸は煙道にて計測した。

5. 本書の遺物実測図における用例は以下のとおりである。

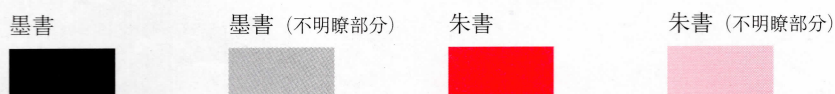
(1) 縮尺率は原則として以下のとおりであるが、個々については図協に示したスケールを参照されたい。

土器実測図 1/4 土器拓影図 1/4 土製品 1/3 石器・石製品 1/2 1/3 1/4
鉄器・鉄製品 1/4 銅製品 1/2 支脚 1/4



(2) 遺物実測図中のスクリーントーンの表示は以下のとおりである。

(3) 墨書・朱書は以下のスクリーントーンで表現した。墨書・朱書は不明瞭な部分が多いため、明瞭な部分はベタ塗り、不明瞭な部分は20%のトーンをかけて処理した。さらに文字の輪郭がはっきりしている部分は縁取りを行った。なお、推定復元部分は破線で示した。



第1章 上谷遺跡Ⅲ地区の概要

第1節 上谷遺跡Ⅲ地区の調査の経緯

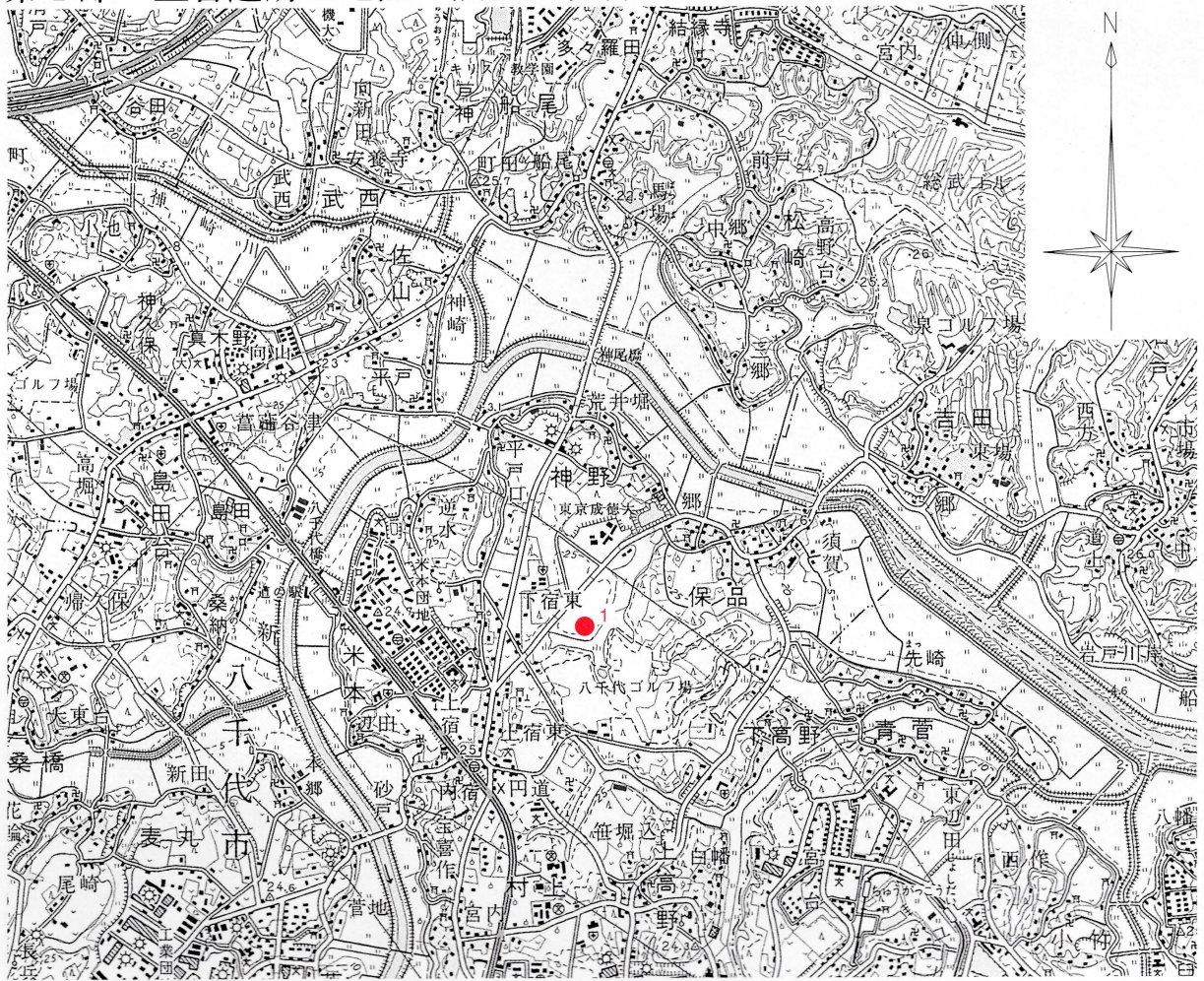


図1 上谷遺跡位置図(1/50,000)

上谷遺跡の発掘調査は、(仮称)八千代カルチャータウン開発事業関連区域内における埋蔵文化財発掘調査の一環として行われた。例言に記したとおり本報告書は『(仮称)八千代カルチャータウン開発事業関連埋蔵文化財発掘調査報告書』としては6冊目にあたり、「上谷遺跡」としては3分冊目となるものである。発掘調査を含めた事業全体の経緯等の詳細は、既刊の『栗谷遺跡—第1分冊—』及び『上谷遺跡—第1分冊—』を参照していただき、ここでは上谷遺跡Ⅲ地区の調査経緯について触れておきたい。

上谷遺跡の発掘調査は平成4年4月より10月にかけて第1次確認本調査を、また、平成7年7月から3月にかけて第2・3次確認調査を行った。そして平成8年度から10年度にかけて、第2・3・4次本調査を実施した。このうちⅢ地区の調査は第3次及び第4次本調査の一部がこれにあたり、調査面積は約21,400㎡であった。

調査区の設定にあたっては、上谷遺跡の報告書の第1分冊や第2分冊で触れたとおり、公共座標系に沿ってグリッドを設定した。100m方眼を大グリッド、10mを中グリッド、5mを小グリッドとして調査を進めた。表土層は重機による除去を行い、ソフトローム上面を遺構確認面とした。そして写真撮影や必要に応じた遺構図面をとりながら、遺構覆土の除去と遺構の精査を行った。記録写真はブローニー判モノクロフィルムを基本として、35mmカラーリバーサルフィルム等を適時に使用した。測量は、遺物については光波測距儀による測量を、遺構については航空測量を基本に行い、それぞれで補完することとした。

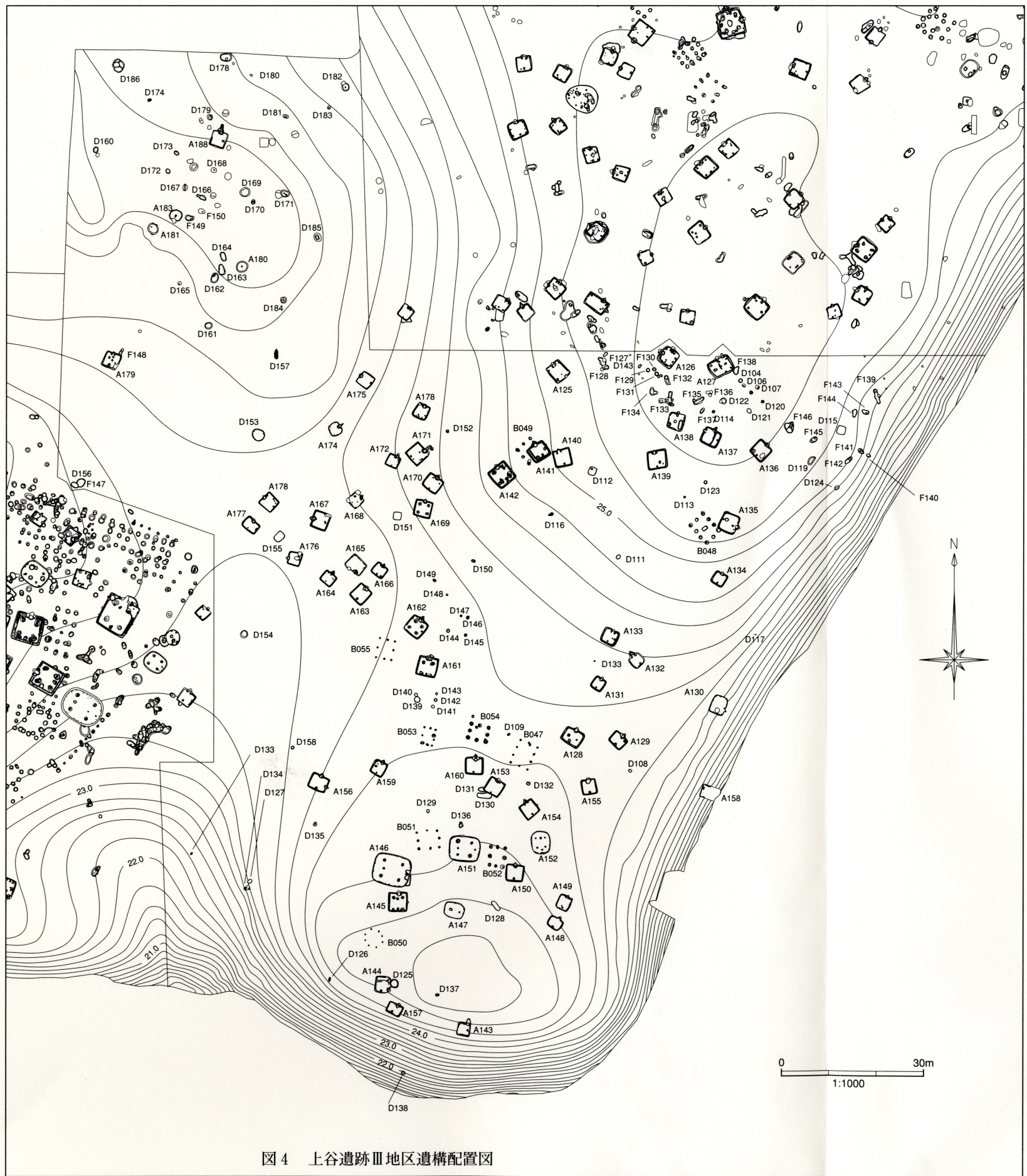


图4 上谷遗址Ⅲ地区遗构配置图

